

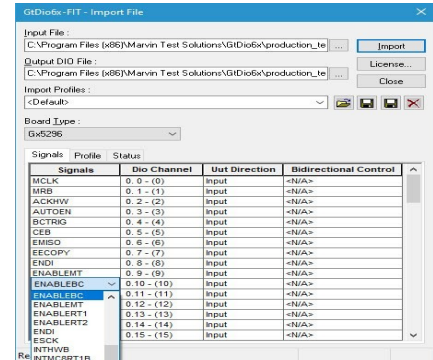
MARVIN TEST SOLUTIONS

GtDio6x-FIT

STIL、WGL、VCD/EVCD、ATP ベクタのインポートおよび変換を行うファイル・インポート・ツール

FILE IMPORT TOOL FOR IMPORTING AND CONVERTING STIL, WGL, VCD/EVCD, ATP VECTORS

- STIL デジタル・ベクタ (IEEE-1450、Standard Test Interface Language ファイル) を MTS デジタル・ベクタ形式にインポート／変換
- WGL デジタル・ベクタ (TSSI Waveform Generation Language ファイル) を MTS デジタル・ベクタ形式にインポート／変換
- VCD/EVCD デジタル・ベクタ (IEEE-1364、Value Change Dump ファイル) を MTS デジタル・ベクタ形式にインポート／変換
- ATP デジタル・ベクタを MTS デジタル・ベクタ形式にインポート／変換
- Marvin Test Solutions の GX5296 および GX5960 シリーズ PXI デジタル計測器に対応
- ピン・リマッピングによりピン割り当ておよび無視 (ignore) 機能をサポート
- 定義済みプロファイルによりインポート設定を保存でき、複数回／繰り返しのファイル・インポートと変換を簡素化
- GtDio6x 関数ライブラリと連携して動作するアドオン・ライセンス・オプション



概要 (DESCRIPTION)

Marvin Test Solutions の GtDio6x-FIT オプションは、STIL、WGL、VCD/EVCD、ATP の各ファイルを Marvin Test Solutions のデジタル計測器ファイル形式にインポートおよび変換するためのソフトウェア・ツールセットをテストエンジニアに提供します。GtDio6x-FIT は、MTS の GX5296 および GX5960 シリーズ・デジタル計測器向けにデジタル・テストベクタの開発、デバッグ、実行を行うための効率的なツールセットである Marvin Test Solutions の GtDio6x 関数ライブラリ・ソフトウェアと連携して動作します。

Standard Test Interface Language (STIL, IEEE-1450) は、複数のテスト装置ベンダ、CAE (computer aided engineering)、CAD (computer aided design)、および IC ベンダのコンソーシアムによって策定されました。この規格は、設計環境からテスト環境へデジタル・テストデータ・ベクタを転送するための共通言語を提供します。

Waveform Generation Language (WGL、「wiggle」と発音) は、Test System Strategies Inc. (TSSI) が作成したデータ記述言語です。WGL ファイルは基本的にテキストファイルであり、信号パターンとともにタイミング、診断、その他の情報を含みます。WGL ベクタ形式は、製品開発における設計検証および量産テストの各段階で半導体デバイスをテストするためにエンジニアが広く使用しています。これらのベクタは EDA (electronic design automation) ツールによって生成され、デバイスのテストと、その物理的な実装がシミュレーションで得られた結果と一致することの検証に用いられます。

VCD および EVCD ファイル形式は IEEE-1364 (IEEE Standard for Verilog® Hardware Description Language) の一部です。Extended VCD (EVCD, IEEE-1364-2001) は VCD ファイル形式の新しいバージョンであり、方向性データをサポートします。ATP ファイル形式は、Teradyne の半導体テストシステムで使用されるデジタル・テストベクタ形式です。

GtDio6x-FIT と GtDio6x ライブラリは、上記のファイルをインポートし、DIO カードにロードできる DIO ファイル形式に変換する機能を提供します。ファイルのインポート時、ソフトウェアは入力ファイルを解析し、入力ファイルの機能とタイミングを可能な限り保持しながら、GX5296 または GX5960 シリーズの能力に適合する MTS デジタル・ファイルを作

成します。生成されたDIO ファイルは、ストリムラス／レスポンス (stimulus / response) およびリアルタイム比較 (RTC: real-time compare) の両方の動作モードをサポートします。

アプリケーション (APPLICATIONS)

- 半導体テストシステム
- デジタル・テストシステム
- ミックスド・シグナル・テスト
- デジタル・エミュレーション・システム
- ハイブリッドおよび SoC 部品テスト

仕様 (SPECIFICATIONS)

GTDIO6X 用ファイル・インポート・ツール・オプション — 機能 (FILE IMPORT TOOL OPTION FOR GTDIO6X - FEATURES)

対応ファイル形式 (Supported File Formats)	STIL デジタル・ベクタ (IEEE-1450、Standard Test Interface Language ファイル) WGL デジタル・ベクタ (TSSI Waveform Generation Language ファイル) VCD/EVCD デジタル・ベクタ (IEEE-1364-2001、Value Change Dump ファイル) ATP デジタル・ベクタ (Teradyne ファイル形式)
対応デジタル・テスト・ハードウェア (Supported Digital Test Hardware)	GX5296、3U PXI、32 チャンネル・デジタル計測器
対応デジタル・チャンネル幅 (Supported Digital Channel Width)	最大 512 チャンネル (ハードウェア構成に依存)
デジタル・ベクタ深さ (Digital Vector Depth)	最大 64 Mb/channel (ハードウェア構成に依存)

対応デジタル計測器 (COMPATIBLE DIGITAL INSTRUMENTS)

GX5296	3U PXI、125 MHz、32 チャンネルのダイナミック・デジタル計測器。チャンネルごとのタイミング、プログラマブル・ピンエレクトロニクス、ピンごとの PMU を搭載。
---------------	--

注: 仕様は予告なく変更される場合があります。

オーダー情報 (ORDERING INFORMATION)

オーダー情報 (ORDERING INFORMATION)

GtDio6x-FIT	GX5296 DIO 用デジタル・ファイル・インポート・ツール・オプション
GtDio6x-FIT-S1Y	GtDio6x-FIT サブスクリプションおよびサポートの更新 1 年 (継続契約が必要)
GtDio6x-FIT-S2Y	GtDio6x-FIT サブスクリプションおよびサポートの更新 2 年 (継続契約が必要)
GtDio6x-FIT-S3Y	GtDio6x-FIT サブスクリプションおよびサポートの更新 3 年 (継続契約が必要)
GtDio6x-FIT-EXP6	期限切れ GtDio6x-FIT サブスクリプションおよびサポートの 1 年更新 (期限切れ 1 日~6 か月)
GtDio6x-FIT-EXP24	期限切れ GtDio6x-FIT サブスクリプションおよびサポートの 1 年更新 (期限切れ 7~24 か月)
GtDio6x-FIT-SUP	GtDio6x-FIT の 1 年サポートのみ (アップグレードなし)

お問い合わせ (CONTACT)

本製品に関するご質問、お見積り、デモンストレーションのご依頼は、下記までお気軽にご連絡ください。

アンドールシステムサポート株式会社 (ANDOR SYSTEM SUPPORT CO., LTD.)	
部署	自動テストソリューション事業部
所在地	〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 66-2 興和川崎西口ビル 8 階
TEL	044-201-7844（代表）
E-mail	marvintest@andor.jp
Web	https://www.andor.jp/
お問い合わせ	https://www.andor.jp/company/contact/

本書は Marvin Test Solutions, Inc. の英文データシート（Revision A • Updated Apr 7, 2026）を日本語に翻訳した参考資料です。仕様は予告なく変更される場合があります。正式な仕様は英文原本を参照してください。

Copyright © Marvin Test Solutions, Inc. All rights reserved. 記載の製品名および社名は各社の商標です。